GaInN/GaN 規則配列ナノコラム結晶における 活性層の構造と光学特性の関係

Relationship between active layer structures and optical properties of GaInN/GaN selective area grown nanocolumn crystals

工学院大¹, 上智大理工², ^o吉田圭吾¹, 滝本啓司², 富樫理恵², 野村一郎²,

山口智広¹, 尾沼猛儀¹, 本田徹¹, 岸野克巳²

Kogakuin Univ.¹, Sophia Univ.², [°]Keigo Yoshida¹, Keiji Takimoto², Rie Togashi², Ichiro Nomura², Tomohiro Yamaguchi¹, Takeyoshi Onuma¹, Tohru Honda¹, Katsumi Kishino² E-mail: cm19050@ns.kogakuin.ac.jp

はじめに: GaInN は、GaN と InN からなるIII族窒化物半導体混晶で、In 組成比によりバンド ギャップを 3.4 eV から 0.63 eV まで変化させることができる。しかし、発光波長の長波長化と ともに、GaN と GaInN 間の格子不整合(格子ひずみ)が増加し、不整合転位とともにピエゾ電界 発生による量子閉じ込めシュタルク効果(QCSE)が増加し、発光効率が低下して、赤色域までの 高効率発光が妨げられている。一次元柱状ナノ結晶、ナノコラムでは、貫通転位フィルタリン グとひずみ抑制効果が発現され、GaInN/GaN 系材料の課題が軽減されうる^{III}。また Ti マスクを 用いた選択成長法^[2]によって、ナノコラム径 D と配列周期 L が精密に制御された規則配列ナノ コラム結晶を成長でき、規則配列 GaInN/GaN ナノコラムでは、コラム径による発光色制御が得 られ^[3]、同一基板上に RGB 三原色 LED 集積化が実現しうる^[4]。本研究では、同一基板上に周期 とコラム径が異なる複数の三角格子配列 GaInN/GaN ナノコラム結晶を成長し、光学特性のコラ ム構造依存性を調べたので報告する。

実験方法・結果: (0001)サファイア上 HVPE 成長 GaN テンプレート表面に、電子線(EB) 蒸着 法によって厚さ 5nm の Ti 薄膜を成膜し、電子線描面(EBL)によって、*L*=80-350 nm の三角格子 配列ナノホールパターン描画を行い、ICP (Inductively Coupled Plasma) ドライエッチングで選択 成長用 Ti ナノホールマスクを形成した。このパターン基板を用いて RF-MBE (Radio-Frequency Plasma-Assisted Molecular Beam Epitaxy)法によって、規則配列 Si 添加 n-GaN ナノコラム(高さ h~700 nm)を成長し、そのナノコラムトップに GaInN バルク発光領域を成長させた。成長サン プルの光学特性を室温でフォトルミネッセンス(PL)、時間分解 PL、カソードルミネッセンス (CL)法によって評価した。Fig. 1(a)の PL スペクトルをみると、周期の増加とともにコア GaInN の発光波長は 510 から 650 nm まで単調に増加した。時間分解 PL によって周期 *L*=80-270 nm の ナノコラム結晶のキャリア寿命時間を測定し、Fig. 1(b)を得た。寿命時間は *L*=90 nm で最大値で あったが、その後は周期とともに減少し、*L*=190-240 nm では増加傾向が見られた。一方、加速 電圧 3.0 kV で CL 測定を行ったところ、Fig. 2 に示すような面内の発光分布が観察され、コア シェル活性層構造の形成が示された。ここで得られた規則配列ナノコラム発光現象は、コラム 径による GaInN 発光波長と表面再結合変化、コラム間の発光バラツキが複雑に絡みあって発現 されると考えられ、今後はそこに着目してナノコラム発光特性の理解を進める。



<u>謝</u>辞:本研究の一部は、科研費・基盤研究(A)(#19H00874)の援助を受けて行なわれた。 文献: [1] K. Kishino *et al.*, Nanotechnology **26**, 225602 (2015). [2] K. Kishino *et al.*, J. Cryst. Growth **311**, 2063 (2009). [3] H. Sekiguchi *et al.*, Appl. Phys. Lett. **96**, 231104 (2010). [4] K. Kishino *et al.*, Appl. Phys. Express **13**, 014003 (2020).